

FH MÜNSTER
University of Applied Sciences



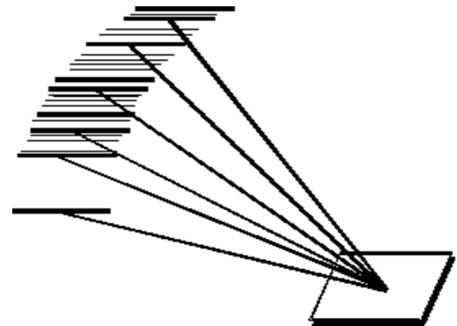
26.

Anwendertreffen

**Röntgenfluoreszenz- und
Funkenemissionsspektrometrie**

Steinfurt

6. – 7. März 2019



Der Deutsche Arbeitskreis für Analytische Spektroskopie (DAAS) veranstaltet gemeinsam mit der FH Münster, dem Chemikerausschuss des Stahlinstituts VDEh und dem ISAS – Leibniz-Institut für analytische Wissenschaften – ein Treffen von Anwendern der Röntgenfluoreszenz - und Funkenemissionsspektrometrie sowie verwandter Methoden der Feststoffanalytik.

Ziel des Anwendertreffens ist es, Forschung und Industrie zusammenzuführen, um den Informationsaustausch zu fördern und neue Entwicklungen anzuregen. In Kurzvorträgen wird über instrumentelle Neuentwicklungen, Lösungen aktueller Fragestellungen und insbesondere über den Einsatz dieser Methoden in Laboratorien verschiedenster Bereiche der Industrie berichtet.

Tagungsort und Termin

6. bis 7. März 2019
FH Münster
Gebäude S
Stegerwaldstr. 39
48565 Steinfurt

Organisation

Dr. A. von Bohlen

Dr. J. Flock

M. Sc. S. Hanning

Prof. Dr. M. Kreyenschmidt

Dr. E. Pappert

Online-Anmeldung unter www.fh-muenster.de/ia

Kontakt:

M. Sc. Stephanie Hanning

FH Münster

Fachbereich Chemieingenieurwesen

Instrumentelle Analytik

Stegerwaldstr. 39

48565 Steinfurt

Fax 02551 962 429

E-Mail awt@fh-muenster.de



Aus organisatorischen Gründen erfolgt keine schriftliche Bestätigung der Anmeldung.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Die Vorträge werden nach Abschluss der Veranstaltung zum Download bereitgestellt.

6. März 2019

J. Niederstrasser, Witten

Die Bestimmung von Seltenen Erden in Metallen und Metalllegierungen mit Hilfe der Funkenemissionsspektrometrie

G. Zimmermann, Aachen

Einschlusserkennung in Aluminiumlegierungen mittels Einzelfunkenspektrometrie

W. Vautz, Dortmund

Ion Mobility Spectrometry – A Flexible, Sensitive and Mobile Analytical Tool for a Multitude of Applications

H. Rehbock, C. Wiedmann, S. Marshall, G. Noble, Dreieich

Optimization of Sintering process using On-Line PGNAA technology in integrated steel production

J. Flock, Duisburg

Labor 4.0 – Realität und Perspektiven

B.-J. Schlothmann, Düsseldorf

Zertifizierte Referenzmaterialien – eine Voraussetzung für die qualitätsorientierte Analytik

A. von Bohlen, Dortmund

Bestrebungen eine DIN-Norm für die TXRF aufzustellen

A. Nutsch, A. Sehorz, Sindelfingen

Rückführung und Validierung von Kalibrierproben für dünne Metalllegierungsschichten für die Röntgenfluoreszenzanalyse

M. Haschke, Eggersdorf

Quantifizierungsmodelle – Vor- und Nachteile

D. Heyden, V. Hamelbeck, Kleve

Qualitätssicherung durch ED-XRF mit softwaregestützter Proben-Identifikation

M. Krämer, Dresden

Schichtdickenkalibrierung – So dick wie nötig, so dünn wie möglich

S. Scheller, Berlin

Verschieben von Grenzen mit Mikro-RFA – leichter wird leichter

S. Mann, Überlingen

Anwendungen mit einem ED-RFA Benchtop-System mit Secondary Targets

7. März 2019

J. Schram, G. Renner, J. Düx, D. Wolfram, Krefeld

New Sampling Techniques for Archeometric Objects: Antiquarian Books and Metal Objects

L. Bauer, H. Mustafa, P. Zaslansky, B. Kanngießer, I. Mantouvalou, Berlin

Heute schon Zähne geputzt? Was passiert zwischen Füllung und gesundem Zahn?

A. von Bohlen, Dortmund

Analytik an Kunst und Kulturobjekten mittels Synchrotron Strahlung

S. Hanning, Steinfurt

Höher – weiter -... Grenzfälle für die RFA?

T. Bach, Hirschau

Chemische Beständigkeit von Glas und ihre Bedeutung für die chemische Analytik

J. Stelling, Karlsruhe

Analyse von Metallpulvern für den 3D-Druck mit der WD-RFA

E. Pappert, Duisburg

Schmierstoffanalytik mit EDXRF und WDXRF – ein Vergleich

J. Wess, Kassel

Interessante Applikationen in der Röntgenfluoreszenzanalyse

Wie neue Entwicklungen in der Gerätetechnik die RFA voranbringen: Industrielle Applikationen mit kompakten Geräten gelöst!

F. Portala, K. Behrens, J. Stelling, K. Termin

S. Welzmüller, R. Yerly, D. Bonvin, R. Yellepeddi, Ecublens

Chemical and Structural Analysis of Direct Reduced Iron XRF and XRD

R- Schramm, Bedburg-Hau

Applikationspakete für die Röntgenfluoreszenzanalyse

P. Lemberge, D. Bonvin, R. Yellepeddi, Ecublens

Role of X-ray analysis in meeting the increasing demand from environmental and industrial labs